

Микроскоп интерференционный автоматизированный МИА-2

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ бесконтактного измерения формы поверхности объектов в микро- и нанодиапазонах высот, высотных и шаговых параметров шероховатости, толщины тонких пленок, распределения показателя преломления и пр.

МИКРОСКОП ПОЗВОЛЯЕТ исследовать отражающие объекты, состоящие из различных по своим электрическим свойствам материалов (диэлектрик, проводник и пр.).

МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ в биологии для исследования микробиологических объектов без окрашивания, размещенных на зеркальной поверхности.



Поле зрения, мкм	130 × 175
Диапазон измерения высот, мкм	0,0001 ÷ 3,0000
Разрешающая способность	
· в плоскости XY, мкм	0,3
· по оси Z, Å	0,8
Диапазон измерения показателя преломления	1 ÷ 2
Абсолютная погрешность измерения показателя преломления	1·10 ⁻³
Источники излучения	светодиод
Длина волны, мкм	0,532
Алгоритм реконструкции	метод фазовых шагов
Размерность изображения, пиксель	1392 x 1040
Время измерения и обработки, сек	30
Число обрабатываемых интерференционных картин	9